

Mr. Yoshiomi Ohara Q67592

Page 2

Priority is claimed from:

Country

**Application No** 

Filing Date

Japan

2000-397163

27 / December / 2000

The priority document is enclosed herewith.

Respectfully submitted, SUGHRUE MION, PLLC

Attorneys for Applicant

Darryl Mexic

Registration No. 23,063

DM/mrl

【書類名】

特許願

【整理番号】

121203

【提出日】

平成12年12月27日

【あて先】

特許庁長官 及川 耕造 殿

【国際特許分類】

H01L

【発明者】

【住所又は居所】

石川県金沢市大豆田本町甲58 澁谷工業株式会社内

【氏名】

寺田 透

【発明者】

【住所又は居所】

石川県金沢市大豆田本町甲58 澁谷工業株式会社内

【氏名】

松本 康久

【特許出願人】

【識別番号】

000253019

【住所又は居所】 石川県金沢市大豆田本町甲58

【氏名又は名称】

**澁谷工業株式会社** 

【代表者】

澁谷 弘利

【代理人】

【識別番号】

100080104

【住所又は居所】 東京都大田区西蒲田7-46-9 月村ビル5階

【弁理士】

【氏名又は名称】

仁科 勝史

【電話番号】

03-3732-0137

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

064688

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9900356 【プルーフの要否】 要

【書類名】

明細書

【発明の名称】

ボンディング装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】

チップを保持するボンディングツールと、基板を載置する基板ステージと、ボンディングツールと基板ステージを水平面内で相対移動させる移動機構と、ボンディングツールに保持されたチップを下方から認識するチップ認識カメラとを備え、チップ認識カメラによる認識結果に基づきチップと基板を位置合わせし、ボンディングツールを下降させてチップを基板に接合するボンディング装置において、チップ認識カメラを基板ステージの基板載置面の高さよりも下方に配置するとともに、基板のチップ接合面の位置とほぼ等しい高さにチップ下面を位置させた状態で、チップ認識カメラにてチップ下面を認識し、チップと基板との位置合わせを行うことを特徴とするボンディング装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、チップを基板(リードフレーム、TABテープを含む)に接合するボンディング装置の改良に関するものであって、主としてフリップチップボンディング装置でのチップと基板の位置合わせにおけるチップ認識手段を主眼に開発されたものである。

[0002]

【従来の技術】

従来より、ボンディングツールはチップトレイやウエハ上のチップを吸着すると上昇して、水平方向へ相対的に移動して基板上方に位置し、下降して基板にチップをボンディングするように構成されている。そして、位置合わせのためのチップの画像認識は、タクトタイムを短縮するため、チップの水平方向への相対移動途中の上昇した高さ位置で停止し、チップを下方からチップ認識カメラにて認識するようになっていた。

[0003]

ボンディングツールを昇降させるヘッド昇降機構の構成部材であるボールねじ、ガイド等は、図3(イ)に示されるように時間の経過とともに熱膨張等の原因で昇降軸(同図中点線で示されている。)に若干の傾きが生じる場合がある。

[0004]

他方、ボンディングツールは傾いた昇降軸に沿って昇降するため厳密には垂直に昇降できなくなる。そのため、チップ認識カメラで認識したチップの接合面より高い位置からチップを基板に向けて下降させても、図3(ロ)に示されるように実際には微少にずれた位置にボンディングされてしまう。

[0005]

チップ認識カメラでチップを認識する高さと基板上面の間隔が離れるほど、このずれ幅は大きくなる。従来のように接合バンプ及び許容ずれ幅が大きい場合には上記微少のずれは問題とならないが、接合バンプが微小化し、許容ずれ幅が1μmとか0.5μmとかの精度で要求される場合、上記微少なずれも無視できるものではない。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】

本発明は上記問題点を解決するため、チップと基板の位置合わせのためのチップの認識を基板のチップ接合面とチップ下面とが概ね同一平面となる位置で行い、チップと基板の接合高さにおける認識画像により位置合わせを行うので、経時変化 (例えば熱変形) による影響が無くなり、高精度の位置合わせを行うことが可能なボンディング装置を提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】

本発明は、上記目的を達成するため以下の手段を採用する。

第1に、ボンディング装置に、チップを保持するボンディングツールと、基板 を載置する基板ステージと、ボンディングツールと基板ステージを水平面内で相 対移動させる移動機構と、ボンディングツールを昇降させる昇降機構と、ボンディングツールに保持されたチップを下方から認識するチップ認識カメラとを備え る。

[0008]

第2に、チップ認識カメラによる認識結果に基づきチップと基板を位置合わせ し、ボンディングツールを下降させてチップを基板に接合するボンディング装置 とする。

第3に、チップ認識カメラを基板ステージの基板載置面の高さよりも下方に配置する。

第4に、基板のチップ接合面の位置とほぼ等しい高さにチップ下面を位置させ た状態で、チップ認識カメラにてチップ下面を認識する。

第5に、上記認識画像によりチップと基板との位置合わせを行う。

[0009]

#### 【発明の実施の形態】

以下、図示の実施例と共に本発明の実施の形態について説明する。図1は、本 発明が利用されるボンディング装置の概略図であり、図1に現れるボンディング 装置は、フリップチップボンディング装置である。

#### [0010]

該フリップチップボンディング装置は、 チップ1を保持するボンディングツール2と、基板3を載置する基板ステージ4とを有する。実施例でのチップ1及び基板3は共に厚さ0.3から0.5ミリメートル程度のものを用いている。尚、基板3には、リードフレームやTABテープ等も含まれる。

#### [0011]

ボンディングツール2は、図1に示されるように、ボンディングヘッド5の下端部に装着されている。尚、図示されていないがボンディングツール2には、チップ吸着穴が設けられており、連結口を介してバキューム装置により吸引され、ボンディングツール2にチップ1を吸着する機能を有する。

#### [0012]

ボンディングツール2は、ボンディングヘッド5と共に乙軸駆動モータ6及び ヘッド昇降機構7とにより上下移動可能とされている。ヘッド昇降機構7の詳細 は図示されていないが、乙軸駆動モータ6の回転を伝えるボールねじ、ガイド等 よりなる。ボンディングヘッド5は支持部材8に昇降自在に支持されている。尚、支持部材8には基板認識カメラ14が下方に向かって設置されている。

[0013]

実施例でのボンディングヘッド5には、水平方向(図中前後及び左右方向)への駆動機構は有しない。勿論、基板ステージ4側にXYテーブル10ごとき移動機構を有しない場合には、水平方向への駆動機構を設けなければならない。尚、図中9は、ボンディングツール2に回転運動を与えるΘ軸駆動モータである。

[0014]

本実施例には、ボンディングツール2と基板ステージ4を水平面内で相対移動 させる移動機構としてXYテーブル10が存在する。図示されていないX軸駆動 モータとY軸駆動モータにより同一平面内で左右移動する。XYテーブル10上 に基板ステージ4を設置している。

[0015]

XYテーブル10上には、基板ステージ4と共にボンディングツール2に保持されたチップ1を下方から認識するチップ認識カメラ11及び、チップ1が収納されたチップトレイ12が設置されている。チップ認識カメラ11のピントが合う位置は、基板3のチップ接合面(図中上面)とほぼ等しい高さの位置となるよう設定されている。

[0016]

実施例でのボンディング装置の作業手順は次の通りである。

第1に、XYテーブル10を移動させ、ボンディングツール2の下方にチップ 1が収納されたチップトレイ12を位置させる。ここで乙軸駆動モータ6の作動 によりボンディングツール2を下降させ、チップ1をボンディングツール2に吸 着させ、上昇させる。

[0017]

第2に、XYテーブル10を移動させ、ボンディングツール2の下方にチップ 認識カメラ11を位置させる。その後、図2(イ)に示すようにボンディングツ ール2を吸着したチップ1下面がチップ認識カメラ11のピントの合う高さとな るまで下降させる。すなわち、チップ1の下面と基板3のチップ接合面がほぼ同 一平面となるようボンディングツール2を下降させるのである。

[0018]

この位置で、ボンディングツール2に吸着されたチップ1の画像をチップ認識 カメラ11にて認識し、位置を確認した後、ボンディングツール2を上昇させる

[0019]

第3に、XYテーブル10を移動させ、基板認識カメラ14の下方に基板3を 位置させ、基板3とチップ1の接合位置での基板3の画像を認識しボンディング 位置を確認する。これにより基板3の接合面とチップ1の下面がほぼ同一の高さ で認識されたことになる。

[0020]

第4に、チップ認識カメラ11と基板認識カメラ14の認識結果に基づいて、 チップ1と基板3の位置が合うようXYテーブル10の移動量を求め、XYテー ブル10を移動させてチップ1と基板3を位置合わせする。この際、必要に応じ てΘ軸駆動モータ9を作動させてボンディングツール2を回転させる。

[0021]

第5に、ボンディングツール2を下降させて基板3にチップ1をボンディング し、ボンディングツール2を上昇させる。この際、ボンディングツール2の昇降 軸に狂いが生じていても、基板3とチップ1の接合位置での画像認識に基づいて 位置合わせを行っているので、ずれることなく正確にボンディングすることがで きるのである。

[0022]

尚、ヘッド昇降機構7の構造及びこれが備えるガイド等の材質にもよるが、画像認識の際のチップ1下面の高さ位置と基板3のチップ接合面高さ位置の誤差が ±5mm以内であれば、ズレは1μm以下となる。

[0023]

又、チップトレイ12の位置がチップ認識カメラ11のピントの合う高さより 下方にある場合、すなわちチップトレイ12が基板3のチップ接合面の高さより 低い位置に存在する場合には、チップトレイ12がチップ1を吸着した後、ボン

ディングツール2の上昇をチップ認識カメラ11のピントの合う高さ(基板3の チップ接合面の高さ)までとし上記第2の行程での下降動作を省略することがで きる。

[0024]

#### 【発明の効果】

本発明は、如上のように構成されるため以下のような効果を発揮する。

本発明は、チップ認識カメラを基板ステージの基板載置面の高さよりも下方に 配置するとともに、基板のチップ接合面の位置とほぼ等しい高さにチップ下面を 位置させた状態で、チップ認識カメラにてチップ下面を認識してチップと基板と の位置合わせを行うものであるので、経時変化(例えば熱変形)による影響が無 くなり、高精度の位置合わせを行うことが可能なボンディング装置となった。

#### 【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本発明が利用されるボンディング装置の概略図
- 【図2】 ボンディングツールと基板認識カメラの関係を示す説明図で、(イ)は、チップ認識カメラでチップ下面を認識している状態を示し、(ロ)は、チップを基板に接合している状態を示している。
- 【図3】 位置ずれ発生の原理を示す説明図で、(イ)は、チップ認識カメラでチップ下面を認識している状態を示し、(ロ)は、ずれ発生の状態を示している。

#### 【符号の説明】

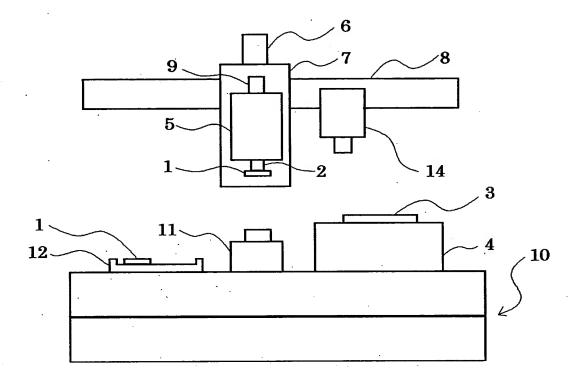
- 1...チップ >
- 2... ボンディングツール
- 3...基板
- 4... 基板ステージ
- 5. . . ボンディングヘッド
- 6... 乙軸駆動モータ
- 7...ヘッド昇降機構
- 8... 支持部材
- 9... Θ軸駆動モータ

- 10... X Y テーブル
- 11... チップ認識カメラ
- 12...チップトレイ
- 14... 基板認識カメラ

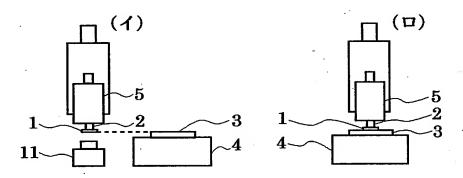
# 【書類名】

図面

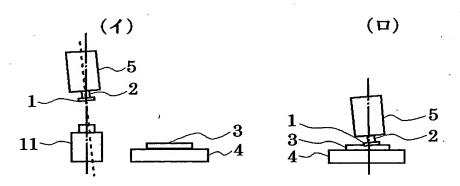
# 【図1】



# 【図2】



【図3】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】

チップの認識を基板のチップ接合面とチップ下面とが概ね同一平面となる位置 で行い、経時変化による影響の無い高精度の位置合わせを行うことが可能なボン ディング装置とする。

## 【解決手段】

第1に、ボンディング装置に、ボンディングツールと、基板ステージと、ボンディングツールと基板ステージの移動機構と、ボンディングツールの昇降機構と、チップ認識カメラとを備える。

第2に、チップ認識カメラによる認識結果に基づきチップと基板を位置合わせ し、チップを基板に接合するボンディング装置とする。

第3に、チップ認識カメラを基板ステージの基板載置面の高さよりも下方に配置する。

第4に、基板のチップ接合面の位置とほぼ等しい高さにチップ下面を位置させ た状態でチップ下面を認識する。

第5に、認識画像によりチップと基板との位置合わせを行う。

【選択図】

図2

# 認定・付加情報

特許出願の番号 特願2000-397163

受付番号 50001689222

書類名特許願

担当官 寺内 文男 7068

作成日 平成13年 1月 4日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】 000253019

【住所又は居所】 石川県金沢市大豆田本町甲58番地

【代理人】 申請人

【識別番号】 100080104

【住所又は居所】 東京都大田区西蒲田7-46-9 月村ビル5階

【氏名又は名称】 仁科 勝史

## 出願人履歴情報

識別番号

[000253019]

1. 変更年月日

1990年 8月23日

[変更理由]

新規登録

住 所

石川県金沢市大豆田本町甲58番地

氏 名

澁谷工業株式会社



Creation date: 11-18-2003

Indexing Officer: LCHEO - LEE CHEO

Team: OIPEBackFileIndexing

Dossier: 10015691

Remarks:

Legal Date: 02-27-2003

No.	Doccode	Number of pages
1	CTNF	5
2	892	1
3	FOR	5

2	892	1	
3	FOR	5	
Tota	l number of pages: 11		

Order of re-scan issued on .....